【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成17年9月2日(2005.9.2)

【公開番号】特開2002-350515(P2002-350515A)
【公開日】平成14年12月4日(2002.12.4)
【出願番号】特願2002-60735(P2002-60735)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ０１Ｒ　31/317
【ＦＩ】
　Ｇ０１Ｒ　31/28　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成17年2月25日(2005.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テストを受ける装置ＤＵＴとしてディジタル回路をテストするための方法であって、
　所定数のサンプリング・ポイントのそれぞれについて、前記ＤＵＴから受信する信号を期待される信号と比較することにより、観測されるディジタル信号の総数に対するエラー・ディジタル信号の比率を表すビット・エラー・レートＢＥＲを求める第一のステップと、
　前記求められたＢＥＲ値がそのサンプリング・ポイントに関するしきいＢＥＲ値を超えるか否かを判定することによって、前記所定数のサンプリング・ポイントのそれぞれに関するテストを実行する第二のステップと、
　前記第二のステップの前記テスト結果を解析して、前記ＤＵＴの状態に関するステートメントを生成する第三のステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第一のステップの前に、論理状態間における遷移特性を代表するサンプリング・ポイントとして、前記所定数のサンプリング・ポイントを選択する第四のステップが含まれることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第四のステップに、以前の測定データを解析して、前記所定数のサンプリング・ポイントを選択する第五のステップが含まれることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第五のステップに、低ＢＥＲ値から高ＢＥＲ値への遷移におけるサンプリング・ポイントを選択する第六のステップが含まれることを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第六のステップに、前記ＤＵＴの許容差に対処するため、前記選択されたサンプリング・ポイントを調整するステップが含まれることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第三のステップにおいて、前記求められたＢＥＲ値の１つがそのサンプリング・ポイントに関するしきいＢＥＲ値を超えると、前記ＤＵＴの状態がテストに不合格とみなされることを特徴とする、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の方法。

【請求項７】
前記第三のステップに、さらに、１つ以上のサンプリング・ポイントに関して求められた前記ＢＥＲ値を事前定義された評価係数で評価することにより、評価基準を適用するステップが含まれることを特徴とする、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の方法をデータ処理装置に実行させるためのプログラムを供給するデータ・キャリア。
【請求項９】
テストを受ける装置ＤＵＴとしてディジタル回路をテストするためのテスト装置であって、
所定数のサンプリング・ポイントのそれぞれについて、前記ＤＵＴから受信する信号を期待される信号と比較することにより、観測されるディジタル信号の総数に対するエラー・ディジタル信号の比率を表すビット・エラー・レートＢＥＲを求めるための処理装置と、
前記求められたＢＥＲ値がそのサンプリング・ポイントに関するしきいＢＥＲ値を超えるか否かを判定することによって、前記所定数のサンプリング・ポイントのそれぞれに関するテストを実行し、前記テスト結果を解析して前記ＤＵＴの状態に関するステートメントを生成する解析装置と、
を含むテスト装置。